

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21276-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab: 28.08.2019**

Ausstellungsdatum: 28.08.2019

Urkundeninhaber:

**mycrolith Messplattenservice und Kalibrierdienst, Inh. Ulrich Bayer  
Ziegelbachstraße 16c, 63755 Alzenau**

Kalibrierungen in den Bereichen:

### **Dimensionelle Messgrößen**

#### **Länge**

- **Ebenheit** <sup>1)</sup>
- **Geradheit** <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> nur Vor-Ort-Kalibrierung

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

**Vor-Ort-Kalibrierung**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
<b>Länge</b> Ebenheitsabweichung Horizontale Eben- heitsverkörperungen	bis 50 µm	bis 10 m Kantenlänge VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6.2:2014		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l$ = Kantenlänge der Ebenheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984
Geradheitsabweichung Horizontale Gerad- heitsverkörperungen	bis 50 µm	bis 10 m Kantenlänge VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6.2:2014		$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l$ = Kantenlänge der Geradheitsverkörperung z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984

**verwendete Abkürzungen:**

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
VDI	Verein Deutscher Ingenieure

<sup>1)</sup> In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k = 2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.